

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14091-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 09.06.2020

Ausstellungsdatum: 09.06.2020

Urkundeninhaber:

nanoAnalytics GmbH
Heisenbergstraße 11, 48149 Münster

Prüfungen in den Bereichen:

**Rasterelektronenmikroskopische (REM) und energiedispersive röntgenspektroskopische (EDX)
Untersuchungen von Oberflächen**

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14091-01-00

Untersuchungen von Oberflächen

1 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen

ISO 17853 2011-03	Verschleiss von Implantatwerkstoffen - Partikel durch Polymer- und Metallverschleiss - Trennung und Charakterisierung (Modifikation: <i>nur Analyse im REM</i>)
DIN EN ISO 2808 2007-05	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke (hier: <i>Elektronenmikroskopie am Querschnitt</i>)
DIN EN ISO 9220 1995-01	Metallische Überzüge - Messung der Schichtdicke - Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop
AA04 2015-10	Abbildung von Material- und Zellkultur-Oberflächen mit Rasterelektronenmikroskopie (REM)

2 Energiedispersive röntgenspektroskopische Untersuchungen

DIN EN ISO 10993-18 2009-08	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 18: Chemische Charakterisierung von Werkstoffen (hier: <i>nur Material-Analyse mit REM/EDX, keine Medizinprodukte</i>)
DIN ISO 22309 2015-11	Mikrobereichsanalyse - Quantitative Analyse mittels energiedispersiver Spektroskopie (EDS) für Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder höher
ASTM E1508-12a 2012	Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-Dispersive Spectroscopy
ASTM F2847-10 2010	Standard Practice for Reporting and Assessment of Residues on Single Use Implants (nur REM/EDX)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14091-01-00

verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
ISO	Internationale Organisation für Normung
IEC	International Electrotechnical Commission
AA	Hausmethode der nanoAnalytics GmbH
ASTM	American Society for Testing and Materials